



第36回日本顕微鏡学会 関東支部講演会

日時：平成24年3月10日(土) 10:30~17:00

会場：東京都市大学世田谷キャンパス 2号館 (東京都世田谷区玉堤1-28-1)

I. 特別講演 (10:30~12:00)

(1) 平田孝道先生 (東京都市大学工学部生体医工学科准教授)

「カーボンナノチューブをベースとしたナノバイオセンサー開発の現状と可能性」

(2) 須原哲也先生 (放射線医学総合研究所分子神経イメージング研究グループリーダー、
東北大学大学院医学研究科客員教授、日本医科大学大学院医学研究科客員教授)

「ポジトロンCTによるヒト生体内分子の可視化」

II. 総会・評議員会(12:10~13:10)

(昼食を兼ねます。弁当代1,000円 [予約制])

III. ポスターセッション (13:20~14:50)

(生物系、材料系の指定教育ポスター、一般会員、高校生セッション、企業展示)

IV. 講評と表彰 (15:00~15:20)

V. 懇親会 (15:30~17:00) 14号館 (SAKURA CENTER) 中2階 (CAFESORA)

(会費：1,000円)

参加費：会員 3,000円 非会員4,000円 学生(学部生、大学院生)無料

予稿集費：1,000円

ポスター発表登録締め切り(平成23年12月26日(月))

ポスター発表予稿原稿締め切り(平成24年1月27日(金))

予稿集の原稿記載様式と提出先

用紙 Word形式でA4 サイズ 1ページ(余白：左右3.0mm 上下3.5mm)

タイトル 14ポイント(MS明朝体)

発表者氏名 12ポイント(MS明朝体)(1行空けてください)

所属 12ポイント(MS明朝体)

本文 1行空けて12ポイント(MS明朝体)、1行38文字、32行以内

(発表ポスターサイズ; A0判(841×1189mm)縦長)

上記の原稿を添付書類で以下のメールアドレスにお送りください。その際に「件名」を「顕微鏡学会関東支部講演会原稿」としてください。よろしくお願い致します。

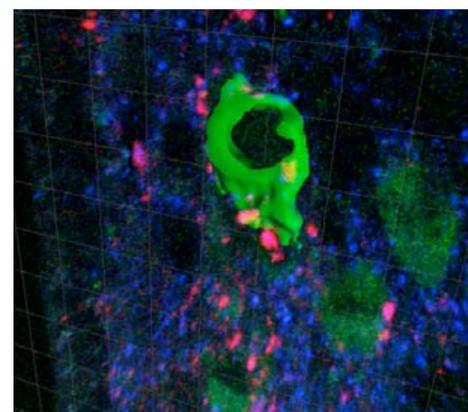
お問い合わせ先 〒113-8602 東京都文京区千駄木 1-1-5

日本医科大学 大学院医学研究科 生体制御形態科学分野

小澤一史(おざわひとし)

TEL 03-3822-2131(内)5299

e-mail: hozawa@nms.ac.jp



第36回顕微鏡学会関東支部講演会指定教育ポスター

(生物系)

- 1) 蛍光抗体法の基本 松崎利行、青木武生、澤井信彦、高田邦昭 (群馬大学大学院)
- 2) コロイド金を標識物とした免疫透過および走査電顕法 鈴木英紀 (日本医大)
- 3) 共焦点レーザー顕微鏡の基礎 高橋麻衣子、Khairani Astrid、多鹿友喜、村上 徹 (群馬大学大学院)
- 4) In situ hybridization による神経細胞の活性解析 飯島典生、託見健、肥後心平、岩田衣世、小澤一史 (日本医大)
- 5) 走査型電子顕微鏡の生物試料作製法 甲賀大輔、牛木辰男 (新潟大学)
- 6) 植物細胞構造の観察と元素分析 金子康子 (埼玉大・教)
- 7) 連続切片作製法とその応用 江原友子 (東京医科大・微)
- 8) 加圧凍結法を用いた酵母細胞の観察 佐藤眞美子 (日本女子大・電顕)
- 9) 凍結技法 (サンドイッチ法) を用いた病原細菌の観察 山田博之 (財団法人・結核研究所)
- 10) 深海生物の試料作製法 植松勝之 ((株) マリン・ワーク・ジャパン)
- 11) 硬組織の試料作製法 西川純夫 (鶴見大学・歯)
- 12) 灌流固定の基礎と応用 勝又修 (北里大: 医)
- 13) スーパー支持膜の特徴および使用法 山口正視 (千葉大)、丸田節雄 (日新EM)

(材料系)

- 1) スピン偏極走査電子顕微鏡 (スピンSEM) とその応用 孝橋照夫 (日立中央研)
- 2) 化学研磨によるアルミニウム表面形態・表面の解析 新藤恵美、吉田明 (東京都市大)
- 3) 熱CVD法によるカーボンナノチューブの合成と構造解析 浜村尚樹、郷間健大、新藤恵美、吉田明 (東京都市大)
- 4) SEM低角散乱反射電子の活用 ~ 傷を観る・高さを測る ~ 青島利裕 (TOTO)
- 5) イオン液体を用いた金属粒子のSEMによる In-situ 観察 橋本陽一郎 (日立ハイテクノロジーズ)
- 6) 高分子材料の電顕観察・評価のためのサンプリング法の検討 広瀬治子 (帝人)
- 7) FIB-SEMを用いたリチウムイオン電池正極材の三次元構造解析への応用 森川晃成 (日立ハイテクノロジーズ)
- 8) イオンスライサーで作製したアスベスト断面のTEM観察 大西市郎 (日本電子)
- 9) 溶液中に分散する微粒子識別のためのクライオ抽出レプリカ法 中山智香子 (日本電子)
- 10) 凍結試料のTEM観察 青山一弘 (日本FEI)
- 11) FIB SEMによるリチウムイオン電池セパレータの三次元構造評価 乙部博英 (旭化成)
- 12) 高分子材料観察のための試料作製 丹羽博嗣 (三菱化学)
- 13) 電子顕微鏡用超軟X線分光器の開発と応用 高橋秀之 (日本電子)
- 14) 電子顕微鏡による高分子界面の可視化と接着機構の解析 堀内 伸 (産総研)
- 15) 生体材料のTEM観察 島貫純一 (日産アーク)
- 16) 凍結試料のFIB加工技法 村田 薫 (日本FEI)

(高校生セッション)

参加校：8校、 発表数：12テーマ